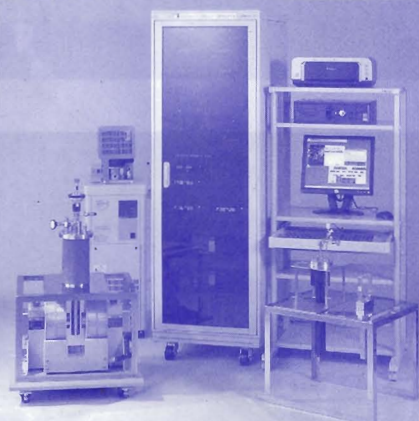


低温・磁気・誘電体物性測定に最適な最新物性評価システム

<http://www.toyo.co.jp/bussei/index.html>



次世代半導体材料の評価に

Resitest 8300型シリーズ ホール電圧／比抵抗測定システム

低抵抗から高抵抗までの低移動度半導体に対応

特許
取得

■特長

- AC磁場によるホール効果測定
- 熱電能測定 (オプション)

■主な測定対象

- アモルファスシリコン、ポリシリコン
- タイヤモンド
- 太陽電池材料
- 熱電材料
- ZnO, ITO



各種低温物性評価に

TTPX型 極低温プローバー

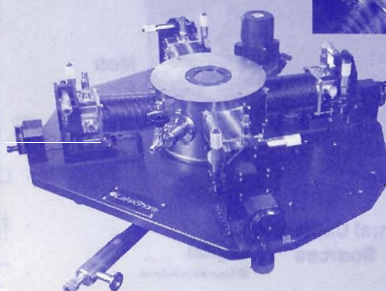
磁石、高真空、ロードロック各種オプション有

■特長

- 温度範囲 : 4.2K~475K (LHe連続フロー方式)
- 周波数レンジ : DC~67GHz
- サンプルサイズ : 最大2インチ
- 4本又は6本の可動プローブ
- 1.5K極低温オプション
- 2.5T垂直磁場、1T水平磁場モデルもラインナップ

■アプリケーション

DC高感度測定 (微小電流等)・磁気抵抗測定
超電導・誘電率測定・インピーダンス測定・光学測定



磁性体・永久磁石の評価に

7404型 振動試料型磁力計

最高感度 0.1 μ emu

■特長

- 最大磁界強度2.1T (シリーズ最高3.1T)
- 低温オプション (6K~425K)
- 高温オプション (最大1273K)

■主な測定対象

磁気ヘッド材料 (GMR, CMR)、TMR、ハードディスク薄膜 金属蒸着テープ、光磁気材料、希土類ネオジウム/鉄/ボロン、サマリウムコバルト化合物 ハードフェライト など

＜東陽テクニカ 物性計測セミナーのご案内＞

「ホール測定等によるワイドギャップ半導体の評価・解析手法について」

日時：2010年5月11日(火) 13:00~16:30(予定)

場所：新大阪ブリックビル 3階

アクセス：新大阪駅西口から徒歩5分

講師：大阪電気通信大学 工学部 電気電子工学科 松浦秀治教授

*上記講演の他に、「ACホール測定システム」「高温(800℃)ホール測定システム」「DLTSシステム」のご紹介、デモンストレーションを予定しております。

セミナーの詳細とお申し込みは こちら→<http://www.toyo.co.jp/bussei/seminar.html>



株式会社 東陽テクニカ 汎用計測営業部

〒103-8284 東京都中央区八重洲 1-1-6 ☎ (03) 3279-0771 FAX (03) 3246-0645 <http://www.toyo.co.jp> E-mail: busseipj@toyo.co.jp

茨城 ☎ 029(851)1366 名古屋 ☎ 052(772)2971 大阪 ☎ 06(6399)9771